

PSS COCBI 系列

COC 抽屉式老化



产品简介

普赛斯 COCBI 老化系统为高功率 COC 老化系统，支持大电流、窄脉冲加电老化，用于 COC 芯片在高温，稳定电流条件的长时间可靠性实验，支持前光功率检测，软件实时监测老化过程数据，支持用户对芯片进行寿命分析和老化筛选；

整机采用抽屉式布局，最多支持 10 层，40 个老化抽屉，可根据具体的老化规模需求配置老化箱的层数。

产品应用

- 适合裸芯片 COC 封装的可靠性验证
- 适合实验室验证或小批量测试

产品特点

- 每个抽屉的温度可独立控温，每个抽屉可独立加载驱动电流，可实现多温区，多品种，多过程老化
- 支持 3A 脉冲式电流、1us 窄脉宽加电老化
- 单层老化箱可独立使用，也可通过机架组合增加老化规模，更加灵活
- 支持输出功率在线监测功能，每个抽屉都可以选配此功能
- 选配 N2 填充保护，支持气密型 LD COC 的老化
- 鱼骨形夹具设计，兼容前端贴片，打线工艺，整个过程无需人工转料
- 加热结构属于平面加热结构，有效提高夹具的温度均匀性
- 完善的数据库，支持本地数据库以及远程服务器 SQL 数据库，实时记录老化过程中的数据，并支持数据曲线回看
- 支持客户 MES 系统
- 系统选配 UPS，防止工厂意外断电
- 系统自锁结构，上电后自锁，防止员工意外热插拔

■ 技术参数

老化主机参数		指标	
系统规格	单抽屉支持 COC 数量	支持夹具定制, 每个夹具支持的数量与 COC 尺寸和加电电流大小相关	
	抽屉个数	4~40	
	抽屉 DUT 发热功率	< 32W	
电参数	直流电流范围	0~2A	
	直流电压范围	0~4V	
	脉冲电流范围	0~3A	
	脉冲峰值电流检测范围	0~3A	
	脉冲峰值电压检测范围	0~5V	
	脉冲加电特性	脉宽: 1us~20us 可调 占空比: 0.01%~10%可调	
光参数	前光峰值功率监测	0~0.1mW,精度 0.5%rdg±1uW 0~1mW,精度 0.5%rdg±5uW 0~10mW,精度 0.5%rdg±50uW 0~500mW,精度 0.5%rdg±2.5mW	
	波长	范围: 850~1700nm	
温控参数	温度范围	RT+20°C~120°C, 更高温度可定制	
	升温速度	典型值: 4°C/Min	
	温度稳定性	±0.5°C, 典型值@100°C	
	温度均匀性	±1°C, 典型值@100°C	
上位机	共享	共享 dll	
	数据库	系统自带 SQL 数据库, 支持客户 MES 系统对接	
	在位检测	支持	
安全防护	EOS	缓慢上下电无过冲	
	ESD	防静电设计	
安装需求		指标	备注
系统电源		AC 220V 50HZ	两相三线制
额定功率		10KW	
工作环境温度		25°C±2°C	
主机占地		4 m ²	
氮气用量		500L/h	氧含量≤1%